

# 최적의 이진 부분접속 복구 부호 생성법

남 미 영\*, 송 홍 엽<sup>o</sup>

## Constructions for Optimal Binary Locally Repairable Codes

Mi-Young Nam\*, Hong-Yeop Song<sup>o</sup>

### 요 약

본 논문에서는 패리티 검사 행렬에 기반하여 부분 접속수가 2인 이진 부분접속 복구 부호의 생성법을 제안한다. 제안하는 부호는 항상 최소거리 6을 갖는다. 이 부호는 부호의 길이와 최소거리가 주어졌을 때 부분접속수가 2인 부호가 가질 수 있는 최대의 차원을 갖는다는 관점에서 최적이다.

**Key Words** : locality, locally repairable codes

### ABSTRACT

We propose some binary locally repairable codes with locality 2 using a parity-check matrix. The minimum distance of the proposed codes is 6. The proposed codes are optimal in the sense of achieving the upper bound of dimension for given length, minimum distance, and locality.

### I. 서 론

분산 저장 시스템은 대용량의 데이터를 네트워크로 연결된 다수의 저장노드에 분산하여 저장하는 시스템으로, 노드 장애에 대응하여 데이터를 안정적으로 저장하기 위해서 다양한 소실 부호가 사용된다<sup>1)</sup>.

노드의 장애와 복구는 빈번하게 발생하기 때문에 효율적인 노드 복구를 가능하도록 하는 소실 부호에 관한 연구가 활발히 이루어지고 있다<sup>2)</sup>.

복구 과정의 효율성을 판단할 수 있는 중요한 척도 중 하나로 부분접속수 (locality)가 사용된다<sup>3)</sup>. 부분접속수는 임의의 노드를 복구하기 위해 접속해야 하는 최소 노드의 수를 의미한다. 부호의 파라미터가 주어졌을 때, 부호가 가질 수 있는 최소 거리의 이론적인 상한계가 제시되었고<sup>3)</sup>, 이러한 한계식을 달성하는 최소거리를 갖는 최적의 부분접속 복구 부호를 생성하는 방법에 관한 연구가 발표되었다<sup>4)</sup>.

부호의 사용에 따른 연산 복잡도를 줄이고 실제 시스템에 효과적인 적용을 위해 작은 크기의 유한체에 서의 부분접속 복구 부호의 생성이 많은 주목을 받았다<sup>5)</sup>. 특히, 이진 부분접속 복구 부호에 관한 연구가 최근 들어 활발히 이루어지고 있다<sup>6,7)</sup>.

$(n, k, r)_q$  부분접속 복구 부호는 크기  $q$ 인 유한체에 서 정의되는 길이  $n$ , 차원  $k$ , 그리고 부분접속수가  $r$ 인 부호라고 하자. 최소거리가  $d$ 인  $(n, k, r)_q$  부분접속 복구 부호의 차원  $k$ 의 유한체의 크기를 고려한 상한계는 다음과 같이 알려져 있다<sup>8)</sup>.

$$k \leq \min_{t \in \mathbb{Z}_+} [tr + k_{opt}^{(q)}(n - t(r + 1), d)], \quad (1)$$

여기서  $k_{opt}^{(q)}(n, d)$ 는 길이  $n$ 이고 최소거리가  $d$ 인 부호가 가질 수 있는 최대의 차원의 크기이다.

본 논문에서는 항상 최소거리가 6인 이진 부분접속 복구 부호의 생성법을 소개한다. 제안하는 부호는 식 (1)의 상한을 달성함으로써 최적이다.

### II. 부분접속 복구 부호의 패리티 검사 행렬

$(n, k, r)_2$  부호  $C$ 의 부호어가  $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 이라 하자.  $i$ 번째 심볼  $c_i$ 의 부분접속수가  $r$  이하라면  $C$ 의 패리티 검사 행렬의 행 공간 (row space)에  $i$ 번째 열의 값이 1이고 무게가  $r+1$ 이하인 행 벡터가 항상 존재해야 함을 의미한다.

이러한 사실로부터 다음과 같은 형태의 패리티 검사 행렬을 갖는 부호가 부분접속수  $r$ 인 부분접속 복구 부호가 됨을 쉽게 알 수 있다.

\* This research was supported by Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea(NRF) funded by the Ministry of Education(No. 2013R1A1A2062061)

• First Author : School of Electrical and Electronic Engineering, Yonsei University, my.nam@yonsei.ac.kr, 학생회원

o Corresponding Author : School of Electrical and Electronic Engineering, Yonsei University, hysong@yonsei.ac.kr, 종신회원

논문번호 : KICS2016-09-249, Received September 9, 2016; Revised September 27, 2016; Accepted September 27, 2016

$$H = \begin{bmatrix} H_L \\ H_G \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1_{r+1} & 0_{r+1} & \dots & 0_{r+1} \\ 0_{r+1} & 1_{r+1} & \dots & 0_{r+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0_{r+1} & 0_{r+1} & \dots & 1_{r+1} \\ H_G^1 & H_G^2 & \dots & H_G^s \end{bmatrix}, \quad (2)$$

여기서  $1_{r+1}$ 과  $0_{r+1}$ 은 모두 길이가  $r+1$ 인 행벡터로 각각 원소가 모두 1인 벡터와 원소가 모두 0인 벡터를 나타낸다. 그리고  $H_G^i$ ,  $i=1,2,\dots,s$ ,는 임의의 정수  $l$ 에 대해, 크기가  $l \times (r+1)$ 인  $H_G$ 의  $i$ 번째 부행렬을 나타낸다.

이러한 행렬을 패리티 검사 행렬로 갖는 부호는  $((r+1)s, rs+l, r)_2$  부호가 된다. 위의 행렬  $H$ 에서 상위 부행렬  $H_L$ 에 의해 부호의 부분접속수가  $r$ 임이 보장된다.

부호의 패리티 검사 행렬  $H$ 의 임의의  $\delta-1$ 개 이하의 열벡터가 항상 선형독립이고 어떤  $\delta$ 개의 열벡터가 선형독립이 아니라면 이 부호의 최소거리는  $d=\delta$ 라는 사실은 잘 알려져 있다. 이 사실로부터 패리티 검사 행렬이 상위 부행렬  $H_L$ 로만 이루어진 경우, 이 부호는 최소거리가  $d=2$ 인 부호가 된다. 하위 부행렬  $H_G$ 를 설계하는 방법에 따라 이 부호의 최소거리가 결정된다.

하나의 부행렬  $H_G^i$ ,  $i=1,2,\dots,s$ ,의 모든  $s$ 개의 열벡터가 서로 다르게 설계함으로써 최소거리가  $d=4$ 인  $(n,k,r)_2$  부호가 제안되었다<sup>6,7)</sup>.

### III. 제안하는 이진 부분접속 복구 부호의 생성

이 장에서는 II장의 (2)와 같은 구조를 갖는 패리티 검사 행렬을 통해 부분접속수가  $r=2$ 인 이진 부분접속 복구 부호를 생성하는 새로운 방법을 제안한다. 이 부호의 패리티 검사 행렬  $H$ 는 다음과 같다.

$$H = \begin{bmatrix} 111\ 000\ \dots\ 000 \\ 000\ 111\ \dots\ 000 \\ \vdots\ \vdots\ \ddots\ \vdots \\ 000\ 000\ \dots\ 111 \\ H_G^1\ H_G^2\ \dots\ H_G^s \end{bmatrix} \quad (3)$$

**정리 1.**  $s$ 는  $s \geq 3$ 인 정수라고 하자. 식 (3)의 행렬  $H$ 의 하위 부행렬  $H_G$ 가 다음 조건을 만족하면  $H$ 를 패리티 검사 행렬로 하는 부호  $C$ 의 최소거리는  $d \geq 6$ 이다.

- ①  $H_G$ 의 모든 열벡터가 서로 다르다.
- ② 임의의 서로 다른 두 부행렬  $H_G^i$ 와  $H_G^j$ 에 대해, 네 개의 열벡터

표 1. 이진 선형 부호의 최대 차원  $k_{opt}^{(2)}(n,6)$   
Table 1. The maximum possible dimension  $k_{opt}^{(2)}(n,6)$  of a binary linear  $(n,k)_2$  code with  $d=6$

	$n=9$	$n=12$
$k_{opt}^{(2)}(n,6)$	2	4

$$h_{i,a}, h_{i,b}, h_{j,c}, h_{j,d}, i \neq j \in \{1,2,\dots,s\},$$

$$1 \leq a \neq b, c \neq d \leq 3, \text{ 가 선형독립이다.}$$

**증명.** 패리티 검사 행렬  $H$ 로부터 선택된 임의의 5개 이하의 열벡터가 항상 선형독립임을 보임으로써 정리 1을 증명할 수 있다. 이때 (3)에서 주어진  $H$ 의 구조에 의해 홀수 개의 열벡터의 선형조합은 항상 영이 아닌 벡터가 되므로, 선형독립이다. 따라서 짝수 개의 열벡터 집합이 항상 선형독립임을 보이면 된다. ①의 특성으로 인해 임의의 두 개의 열벡터는 항상 선형독립이다. 이는 최소거리가  $d \geq 4$ 임을 보장한다.

다음으로 임의의 네 개의 열벡터의 집합을 고려하자. 하나의 부행렬  $H_G^i$ 가 포함되는 세 개의 열벡터를 하나의 그룹  $G_i$ 라고 정의하자. 두 개의 서로 다른 그룹  $G_i$ 와  $G_j$ 로부터 각각 두 개의 열벡터를 선택하는 경우만 고려하면 된다. ②의 특성으로 인해 이렇게 선택된 네 개의 열벡터가 항상 독립임이 보장된다. 이는 최소거리가  $d \geq 6$ 임을 보장한다.

따라서 부호  $C$ 의 최소거리는 항상  $d \geq 6$ 이다. ■

정리 1에서 주어진 두 개의 조건을 만족하는 행렬을 다음과 같이 생성할 수 있다.

$$H_1 = \begin{bmatrix} 111000000 \\ 000111000 \\ 000000111 \\ 000011011 \\ 000101101 \\ 011000011 \\ 101000101 \end{bmatrix}, H_2 = \begin{bmatrix} 111000000000 \\ 000111000000 \\ 000000111000 \\ 000000000111 \\ 000011011011 \\ 000101101101 \\ 011000011110 \\ 101000101011 \end{bmatrix}, \quad (4)$$

$$H_3 = \begin{bmatrix} 11100000000000 \\ 00011100000000 \\ 00000011100000 \\ 00000000011100 \\ 00000000000111 \\ 00001101101101 \\ 00010110110101 \\ 01100001111010 \\ 101000101011110 \end{bmatrix}$$

위의 식 (4)에 주어진 세 개의 행렬  $H_1, H_2, H_3$ 를 패리티 검사 행렬로 갖는 부호를 각각  $C_1, C_2, C_3$ 라고 하자.

$(9, 2, 2)_2$  부호  $C_1$ ,  $(12, 4, 2)_2$  부호  $C_2$ , 그리고  $(15, 6, 2)_2$  부호  $C_3$ 는 모두 부분접속수가 2이고 최소 거리가 6인 이진 부분접속 복구 부호이다.

식 (1)의 상한계를 이용하여 생성된 부호가 최적임을 확인하기 위해, 표 1의  $k_{opt}^{(2)}(n, d)$ 를 이용해 세 부호가 최적임을 확인하였다. 표 1은 [9]를 참조한 것이다. 부호  $C_1$ 은 부분접속수 특성을 고려하지 않더라도 주어진 길이  $n = 12$ 와 최소거리  $d = 6$ 을 갖는 모든 이진 선형 부호가 가질 수 있는 최대 가능한 차원  $k_{opt}^{(2)}(9, 6) = 2$ 를 달성하는 부호이므로 최적이다. 부호  $C_2$ 를 식 (1)에 대입할 경우,  $t = 1$ 일 때 (1)의 우변이 최소가 되고 이때의 값이 4이고  $C_2$ 의 차원과 같다. 따라서 부호  $C_2$ 역시 최적이다. 부호  $C_3$ 을 식 (1)에 대입하면  $t = 1$ 일 때 (1)의 우변이 최소가 되고, 부호  $C_3$ 의 차원이 이때의 값 6과 같다. 따라서 부호  $C_3$ 역시 최적이다.

제안하는 부호의 장점을 알아보기 위해 MTTDL (Mean Time To Data Loss)<sup>[7]</sup>을 이용하였다. [7]의 Proposition 5를 이용해, 기존의 각 부호의 MTTDL을 구한다. 부호의 안정성을 평가할 수 있는 척도로, 3회 반복부호의 MTTDL과의 비교값인  $\zeta = \frac{\text{부분접속복구부호의 MTTDL}}{\text{3회반복부호의 MTTDL}}$ 를 이용하였다. MTTDL 및  $\zeta$ 를 구하는데 필요한 파라미터 및 설정은 [7]을 따랐다. 그림 1은 기존의 최소거리 4인 부호<sup>[7]</sup>와 본 논문에서 제안하는 최소거리가 6인 부호의  $\zeta$ 의 그래프로, 부호의 길이  $n$ 이 증가함에 따라 감소하는 형태를 보인다. 기준선으로 3회 반복부호의  $\zeta$ 인 1을 검정색 실선으로 함께 표시하였다. 파란색 점선은 부분접속수가 2이고 최소거리가 4인 부호<sup>[7]</sup>의  $\zeta$  값이고 포식  $\circ$ 를 갖는 붉은 실선이 제안하는 부호의  $\zeta$ 이다. 부호의 길이  $n$ 이 14 이상이면 [7]의 부호는 3회 반복부호에 비해 MTTDL이 더 작아지는 반면, 제안하는 부호는 103 이하의 부호길이까지는 3회 반복부호보다 큰 MTTDL 값을 갖는다.

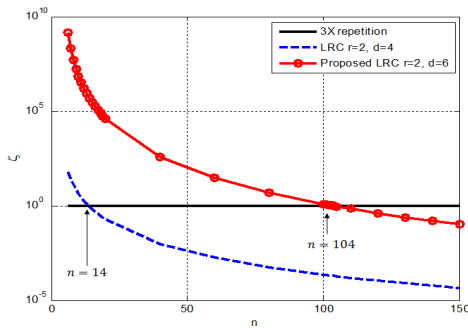


그림 1. 부호 간  $\zeta$ 의 비교  
Fig. 1. The values of  $\zeta$  versus  $n$  of the proposed code and the existing LRC with  $d = 4$

#### IV. 결론

본 논문에서는 패리티 검사 행렬에 기반한 부분접속 복구 부호의 생성법에 대해 소개하였다. 생성된 부호는 항상 최소거리가 6으로, 기존에 알려진 부호에 비해 높은 안정성을 보장할 수 있다. 또한 생성된 부호는 이진부호이므로 복잡도가 낮아 실제 시스템에 적합하다.

#### References

- [1] J.-H. Kim, J. S. Park, K.-H. Park, M.-Y. Nam, and H.-Y. Song, "Trends of regenerating codes for next-generation cloud storage systems," *Inf. Commun. Mag.*, vol. 31, no. 2, pp. 125-131, Feb. 2014.
- [2] M.-Y. Nam, J.-H. Kim, and H.-Y. Song, "Locally repairable fractional repetition codes," *J. KICS*, vol. 40, no. 09, Sept. 2015.
- [3] P. Gopalan, H. Cheng, H. Simitci, and S. Yekhanin, "On the locality of codeword symbols," *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 58, no. 11, Nov. 2012.
- [4] I. Tamo and A. Barg, "A family of optimal locally recoverable codes," *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 60, no. 8, pp. 4661-4676, 2014.
- [8] V. R. Cadambe and A. Mazumdar, "Bounds on the size of locally recoverable codes," *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 61, no. 11, pp. 5787-9448, Sept. 2015.
- [5] A. Zeh and E. Yaakobi, "Optimal linear and cyclic locally repairable codes over small fields," Online available at <http://arxiv.org/pdf/1502.06809.pdf>
- [6] M. Shahabinejad, M. Khabbaziyan, and M. Ardakani, "A class of binary locally repairable codes," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 64, no. 8, pp. 3182-3193, Aug. 2016.
- [7] J. Hao, S.-T. Xia, and B. Chen, "Some results on optimal locally repairable codes," in *Proc. IEEE Int. Symp. Inf. Theory (ISIT)*, pp. 440-444, Jun. 2016.
- [9] M. Grassl, *Bounds on the minimum distance of linear codes and quantum codes*, Online available at <http://www.codetables.de>.